

計測分析に関する講演会 「電子顕微鏡による材料の観察分析事例」 ～透過電子顕微鏡、集束イオンビーム加工観察装置～

開催のご案内

主催:あいち産業科学技術総合センター

共催:(公財)科学技術交流財団

あいち産業科学技術総合センター本部は、県内6カ所の技術センターの本部として、平成24年2月14日に「知の拠点あいち」内にオープンした施設です。種々の高度分析機器が整備され、企業の方々の研究開発・製品開発を支援しています。

このたび、整備した機器のうち、透過電子顕微鏡(TEM)、集束イオンビーム加工観察装置(FIB)による材料の観察分析に焦点を当てた講演会を、当センター本部にて、11月26日(火)に開催します。TEMは、金属やセラミックス、半導体、プラスチック、フィルムなどの材料内部の構造を観察し、材料解析を行うために有用な装置です。また、FIBは、材料表面を観察しながらピンポイントで狙った箇所の断面を作製し、透過電子顕微鏡や走査電子顕微鏡で観察分析するために有用な装置です。

本講演では、企業の開発、不良解析の一助となるような、TEM、FIBを用いた観察分析事例を詳しくご紹介いたします。

講演後には、電子顕微鏡を用いた観察分析に関する個別の技術相談と、当センターの分析機器や隣接するあいちシンクロトロン光センターの見学会をあわせて行います。

参加費は無料です。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

【日時】平成25年11月26日(火) 午後1時30分～午後5時00分

【場所】あいち産業科学技術総合センター本部 講習会室

愛知県豊田市八草町秋合 1267-1 TEL: 0561-76-8315

【プログラム】

時間	内容
13:00 ~ 13:30	受付
13:30 ~ 13:40	開会の挨拶
13:40 ~ 14:50	「電子顕微鏡で何が見えるか：試料作製技術と観察事例」 講師：株式会社 花市電子顕微鏡技術研究所 代表取締役 <small>はないち たかまさ</small> 花市 敬正 氏
15:00 ~ 16:10	「イオンビーム装置を用いた先端材料の解析」 講師：株式会社日立ハイテクノロジーズ 科学・システム営業本部 マーケティング二部 部長代理 <small>いしかわ たけし</small> 石川 尚史 氏
16:10 ~ 16:30	「工業材料の電子顕微鏡観察分析」～事例報告～ 担当：あいち産業科学技術総合センター 共同研究支援部 計測分析室 主任 杉本 貴紀
16:30 ~ 17:00	技術相談会・見学会（希望者のみ） 共同研究支援部内の分析機器、あいちシンクロトロン光センター

■ **申込方法** 下記の申込書にご記入の上、FAX、郵送または電子メールでお送りください。

■ **申込期限** 平成25年11月25日(月)

■ **参加費** 無料

■ **定員** 100名(先着順)

■ **交通のご案内**

- ・ 東部丘陵線リニモ「陶磁資料館南駅」下車、北側すぐ
- ※会場へは公共交通機関を利用してお越しください。

■ **申込及び問合せ先**

あいち産業科学技術総合センター
 共同研究支援部 計測分析室 杉本、大野
 〒470-0356 豊田市八草町秋合1267-1
 電話：0561-76-8315 FAX：0561-76-8317
 メール：AIC0000001@chinokyoten.pref.aichi.jp
 URL：http://www.aichi-inst.jp/



計測分析に関する講演会「電子顕微鏡による材料の観察分析事例」(11/26)
 参加申込書

平成25年 月 日

あいち産業科学技術総合センター 共同研究支援部 計測分析室 杉本、大野 宛
 FAX：0561-76-8317 メール：AIC0000001@chinokyoten.pref.aichi.jp
 ※メールタイトルは「11/26 顕微鏡申込」として下さい。

ふりがな			
企業名			
所在地	〒		
ふりがな			
所属・氏名			
連絡先	TEL	FAX	
	メールアドレス		
相談会・見学会への参加 両方参加も可	相談会参加	見学会参加 (ご希望に○をつけて下さい。)	不参加

※ご記入いただいた個人情報は、セミナー情報の提供等、当センターからの各種連絡のために利用させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

※参加受付証は発行いたしません。直接会場にお越し下さい。

「センターニュース」のメール配信をご希望の場合は、チェックしてください。

